(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-367435 (P2002-367435A)

(43)公開日 平成14年12月20日(2002.12.20)

			() habit H	1 2011	——————————————————————————————————————
(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ			テーマコート*(参考)
H01B 5/14		H01B	5/14	Α	4F100
B 3 2 B 7/02	104	B 3 2 B	7/02	104	4K029
9/00			9/00	Α	5B087
G06F 3/03	3 6 0	G06F	3/033	360H	5 G 3 O 7
// C 2 3 C 14/08		C 2 3 C 1	4/08	D	
		審查請求	未請求。請	情求項の数3 C)L (全 6 頁)
(21)出顯番号	特願2001-169189(P2001-169189)	(71)出願人	000235783		
			尾池工業核	大式会社	
(22)出願日	平成13年6月5日(2001.6.5)	京都府京都市下京区仏光寺通西洞院西入木			
	•		殿山町181		
		(72)発明者	吉田 裕司		
				邓市伏見区竹田向 開発研究所内	代町125 株式
					最終頁に続く
		-			

(54) 【発明の名称】 透明導電性積層体

(57)【要約】

【課題】 透明導電性やタッチパネルに使用されたときの筆記耐久性に優れた、耐久性、可撓性に優れた透明導電積層体性を提供せんとするものである。

【解決手段】 高分子フイルムからなる基材 (A) の少なくとも片面に、インジウム・スズの酸化物を主成分とする透明導電性薄膜 (B) を積層した透明導電性積層体であって、該積層体の耐塩酸性がR/R。値で60分処理において5以上である透明導電性積層体であり、また透明導電性薄膜 (B) が、厚さ10nm~200nmである前記の透明導電性積層体でありさらに、透明導電性薄膜 (B) の他にさらに、アンカーコート層、ハードコート層、防汚層、反射防止層、透明なプラスチック薄膜層が積層されてなる前記の透明導電性積層体である。

【特許請求の範囲】

) : (

【請求項1】 高分子フイルムからなる基材 (A) の少 なくとも片面に、インジウム・スズの酸化物を主成分と する透明導電性薄膜(B)を積層した透明導電性積層体 であって、該透明導電性積層体の耐塩酸性測定法におけ る25℃、60分処理においてR/R。値で5以上であ ることを特徴とする耐久性に優れかつ可撓性に優れた透 明導電性積層体。

【請求項2】 透明導電性薄膜(B)が、インジウムー 錫系酸化物であり、厚さ10nm~200nmである請 10 求項1記載の透明導電性積層体。

【請求項3】 透明導電性薄膜(B)の他にさらに、ア ンカーコート層、ハードコート層、防汚層、反射防止 層、透明なプラスチック薄膜層が積層されてなる請求項 1、または請求項2記載の透明導電性積層体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は透明導電性薄膜の耐 久性、可撓性に優れた透明導電性積層体に関し、さらに タッチパネルにおいて使用される時に筆記耐久性に優 れ、耐撓み性に優れた各種デイスプレイ等特にタッチパ ネルにおいて使用される透明導電性積層体に関するもの である。

[0002]

【従来の技術】近年、透明導電性フイルムを使用した透 明タッチパネル等透明導電性フイルムを使用したデイス プレイが多用されている。そのなかで透明タッチパネル は、指やペンによって所定位置を押圧することで、コン ピューター などに所定の情報等を入力するものであ り、基材フイルム上にインジウムー錫系酸化物薄膜を形 30 成した透明導電性フイルムが多用されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】タッチパネルにおいて は、指やペンによって所定位置を押圧する際、上基材の 透明導電性フイルムの透明導電層と、スペーサーを介し て対向する下基材の透明導電層とで、接触、非接触が繰 り返し行われることにより、上基材の透明導電性フィル ムの透明導電層において歪み等が発生し、透明導電層の 破壊に到る障害が発生することになる。近年益々小型化 する表示体やタッチパネルにおいては、耐久性と同時に 40 繰り返し歪みに耐えうる可撓性が要求されるようになっ てきた。また、アンカーコート層等のコーテイング層と 透明導電膜との密着性が不十分であることや、有機樹脂 のコーティング層の膜硬度が弱い等の理由で、入力耐久 性に劣り、特に表面粗さが特定以上のもでは耐擦傷性や 入力耐久性、耐溶剤性に劣るなどの課題を有するものが 殆どであった。従って本発明は、透明導電性は勿論、耐 久性や可撓性に優れ、タッチパネル等に使用されたとき に筆記耐久性等に優れた可撓性透明導電性積層体(フィ ルム)を提供せんとするものである。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、高分子フイル ムからなる基材 (A) の少なくとも片面に、インジウム ・スズの酸化物を主成分とする透明導電性薄膜 (B) を 積層した透明導電性積層体であって、該透明導電性積層 体の耐塩酸性測定法における25℃、60分処理におい てR/R。値で5以上であることを特徴とする耐久性に 優れかつ可撓性に優れた透明導電性積層体であり、また 透明導電性薄膜(B)が、インジウムー錫系酸化物であ り、厚さ10nm~200nmである前記の透明導電性 積層体であり、さらに透明導電性薄膜 (B) の他にさら に、アンカーコート層、ハードコート層、防汚層、反射 防止層、透明なプラスチック薄膜層が積層されてなる前

2 .

記の透明導電性積層体である。 【0005】本発明は、耐久性、可撓性に優れ、タッチ パネル等に使用したとき筆記耐久性が10万回をこえる 透明導電性積層体を得んとして検討した結果、予想外の ことに耐塩酸性において、5重量%塩酸 (HC1) 水溶 液の25℃、60分処理における、抵抗値の変化率R/ R。値が5以上であるもの、すなわち5%塩酸、25 ℃、60分処理でのRが処理前の初期抵抗値R。に比べ て 5 倍以上に変化してしまうものが、耐久性、可撓性に 優れ、タッチパネル使用したとき筆記耐久性が10万回 をこえる透明導電性積層体となることを見出した。かか る (筆記耐久性が10万回を越える) 5%塩酸、25 ℃、60分処理でのRが処理前の初期抵抗値R。に比べ て 5 倍以上に変化する透明導電性積層体を得るための検 討をなし、例えば**①**高分子フイルムからなる基材 (A) 上に、インジウム・スズの酸化物を主成分とする透明導 電性薄膜(B)を形成するに際しスパッタリシグ時にイ ンジウムー錫の金属ターゲットを用い、雰囲気ガスにお ける酸素分圧を15モル%以下好ましくは13モル%以 下にする、②インジウム・スズの酸化物を主成分とする 透明導電性薄膜(B)を形成するに際しスパッタリング 時に、高分子フイルムからなる基材(A)の温度を50 ℃以上好ましくは60℃以上にする3高分子フィルムか らなる基材(A)上に、インジウム・スズの酸化物を主 成分とする透明導電性薄膜 (B) を形成するに際し、ス パッタリング薄膜形成速度を50nm/分以上好ましく は60nm/分以上にする④高分子フイルムからなる基 材(A)上に、インジウム・スズの酸化物を主成分とす る透明導電性薄膜(B)を形成するに際し、高分子フィ ルムからなる基材 (A) を水分が O. 1 重量%以下好ま しくは0.05重量%以下に乾燥して、スパッタリング 薄膜形成する、等の方法によって、本発明の透明導電性 積層体が得られることを見出した。これらの方法は単独 で用いてもよく、また選択した複数の方法を併用しても よく、これらの方法以外の方法を併用してもよい。

[0006]

50

【発明の実施態様】本発明における、高分子フイルムか

らなる基材(A)としては、透明であってかつ透明導電 性薄膜(B)を形成することのできるものであれば特に 限定されるものではないが、好ましい例としては、ポリ エチレンテレフタレートフイルム、ポリエチレンナフタ レートフイルム、ポリ(メタ)アクリレートフイルム、 ポリカーボネートフイルム、ポリイミドフイルム、ポリ スルフォンフイルム、トリアセチルセルロースフイルム 等のセルロース系フイルム等が挙げられる、その中でも 透明性、耐熱性、強度や伸度等の機械的性質などから、 ポリエチレンテレフタレートフイルム、ポリカーボネー 10 トフイルム、トリアセチルセルロースフイルムのフイル ムが特に好ましいものであり、これらが多層押し出し、 接着剤を使用してのまたは使用しないでの積層体等の形 態をとってもよいものである。積層体は、透明導電性薄 膜(B)を形成する前後のいずれにおいて積層されたも のであってもよい。また、これらのフイルムは、その形 成に際しフイルムの加工性、耐候性、滑り性、難燃性、 抗菌性や帯電性などの電気的性質を改良するために、滑 剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、充填剤、帯電防止剤、 難燃剤、抗菌剤、染料等の色材等を添加せしめてもよ く、これらの添加剤を他樹脂等に含有せしめてフイルム 表面に塗布せしめてもよいものである。

【0007】また、前記フイルムに透明導電性薄膜

(B)を形成するにあたり、予め低温プラズマ処理、コロナ処理、グロー放電処理、前洗浄等の表面清浄化処理等の前処理を施してもよく、透明導電性薄膜(B)と基材フイルムとの密着性などを向上せしめるために、該基材フイルムの表面に、アンカーコート層を形成せしめてもよく、透明導電性薄膜(B)を形成する基材フイルムの反対面にアンカーコート層を形成せしめてもよいものである。これらのフイルムの厚さとしては3~500μm程度であり好ましくは12~300μmである。本発明に用いるアンカーコート層は、その層構成の樹脂等が特に限定されるものではないが、好ましくは形成後の層としては、透明導電性フイルムとの密着性向上や透明性の向上に寄与し、かつ微粒子との親和性にもすぐれたものであるものが好ましい。

【0008】前記アンカーコート層を形成する樹脂等構成成分としては、主として熱硬化型樹脂、若しくは電離放射線硬化型樹脂があり、特に限定されないがメラミン 40 系樹脂、アクリレート系アルコール変性多官能化合物、トリメチロールプロパンアクリレート、トリプロピレングリコールジアクリレート、ペンタエリストールトリアクリレート、1,6ーへキサンジオールアクリレート、チタネート系化合物、アルコキシシラン加水分解縮合系樹脂(シロキサン結合含有樹脂)が挙げられる。なかでもアルコキシシラン加水分解縮合系成分(シロキサン結合含有樹脂)が好ましく使用できる。これらのアンカーコート層は、単層でもよく、異種の層を積層した複層でもよい。アンカーコート層の総厚みは、特に限定されな 50

いが、透明性と耐久性とのバランスから、 $0.02\sim1$ 0μ mの範囲である。

【0009】電離放射線硬化型樹脂は、少なくとも電子 線あるいは紫外線照射により硬化される樹脂を含有する 塗料から形成される。具体的には、光重合性プレポリマ 一、光重合性モノマー、光重合開始剤を含有し、さらに 必要に応じて増感剤、非反応性樹脂、レベリング剤等の 添加剤、溶剤を含有するものである。前記アンカーコー ト層には、本発明の透明導電性積層体の「くっつき」防 止のためや、ニュウートンリング防止効果のため等にシ リカやジルコニア等の平均粒子径1~30nmの微粒子 や平均粒子径 2 0 n m ~ 1 0 μ m径の粒子を添加含有せ しめてもよい。前記の微粒子や粒子は、後記のハードコ ート層等に添加含有せしめてもよい。本発明における透 明導電性薄膜(B)としては、インジウム・スズの酸化 物を主成分とするものであり、CVD、EB蒸着、イオ ンプレーティグ、スパッタリング、等によって形成され るものであり、インジウム・スズの酸化物を主成分とす るものとしては、所謂 I T O (インジウムー錫系酸化 物)があり、このものに、ZnO2、CdO、SnO2 等が適宜微量に、例えば金属として5モル%以下選択 し、含有せしめたものでもよい。

【0010】なかでも、インジウムー錫系酸化物(IT O) が好ましく、インジウムー錫系酸化物 (ITO) に おける錫の含有量が3~15モル%であるものが特に好 ましく、成膜時のターゲットとしては、インジウムー錫 の金属ターゲットやインジウムー錫の酸化物ターゲット を使用してもよいが、好ましくはインジウムー錫の金属 ターゲットである。このインジウムー錫系酸化物(IT O) においては、結晶性のものでもよく勿論非結晶性-結晶性の中間性(混合タイプ)のものでもよいが、本発 明においては結晶性のものが好ましく、成膜後に熱処理 して結晶化させて得られるものもよい。結晶性は、XR D (X線回析法による、222面の測定) 等によって確 認できる。本発明における透明導電性薄膜 (B) の薄膜 厚さは透明性、耐久性など本発明の主旨を損なわないか ぎりにおいては、限定されないが、5~300nm程度 が好ましく、より好ましくは10mm~200mmであ る。

【0011】本発明においては、高分子フイルムからなる基材(A)の透明導電性薄膜(B)を形成する側の反対側にSiOx層を設けてもよくまたは、高分子フイルムからなる基材(A)にアンカーコート層、SiOx層、透明導電性薄膜(B)を順に設けてもよく、SiOx層は本発明の透明導電性積層体の透明性、筆記耐久性などの向上に寄与するものである。SiOx層のxとしては1.5~2.0が好ましく、その厚さは2~50nmが好ましく更に好ましくは5~15nmである。2nmに満たないときは前記のSiOx層の形成効果が僅かであり、50nmを超えるときは透明導電層(B)の透

明性の向上等のための後熱処理などの効果を得難いなど の問題が生じ、経済的にも得策でない。

【0012】このSiOx層の形成法は特に限定されず 電子ビーム蒸着法、加熱蒸着法、スパッタリング法、等 公知の方法が適宜選択採用される。このSiOx層の形 成によって、得られる透明導電性フイルムの透明性が向 上しかつ、ペン入力等に耐えられる、さらに該SiOx 層の水蒸気バリヤー性によると考えられる透明導電性薄 膜(B)の劣化を抑制する等、耐久性も向上する。本発 明の透明導電性積層体は、高分子フイルムからなる基材 10 (A) に、アンカーコート層、SiOx層、透明導電性 薄膜(B)を設けたことで得られる場合もあるが、高分 子フイルムからなる基材 (A) の透明導電性薄膜 (B) を設ける側の他の一面にハードコート層を設けてもよ く、さらに該ハードコート層上にシリコンーフッ素系等 の防汚層を設けてもよいし、また高分子フイルムからな る基材(A)とアンカーコート層との間にハードコート 層を設けてもよく、さらに、高分子フイルムからなる基 材(A)、透明導電性薄膜(B)以外に、アンカーコー ト層、ハードコート層、防汚層、反射防止層、透明なプ 20 ラスチック薄膜層や、さらに他の金属透明導電性薄膜例 えば金属パラジウムや、金、銀、銅、白金、ロジウム等 の金属薄膜を設けてもよいものである。

【0013】本発明でいうハードコート層とは鉛筆硬度 がH以上のものであり、ハードコート層形成としては、 特に限定されないが、熱硬化型樹脂、若しくは電離放射 線硬化型樹脂が挙げられ、メラミン系樹脂、アクリレー ト系アルコール変性多官能化合物、トリメチロールプロ パンアクリレート、トリプロピレングリコールジアクリ レート、ペンタエリストールトリアクリレート、1,630 ーヘキサンジオールアクリレート、チタネート系化合 物、アルコキシシラン加水分解縮合系樹脂(シロキサン 結合含有樹脂)が例示できる。例えば電離放射線塗料を 用いたハードコート層の形成方法としては、通常の塗工 方法、例えば、リバースロール、バー、ブレード、スピ ン、グラビア、スプレー等のコーティングで行うことが できる。本発明でいう防汚層とは、フッ素含有化合物等 公知の撥水、撥油性の機能を有するものを厚さ0.1~ 100 n m程度で、好ましくは透明導電性積層体の透明 導電性薄膜形成面の反対側のハードコート層の最表層に 40 形成する場合が挙げられる。

【0014】本発明における反射防止層とは、高屈折率 層および低屈折率層を使用して本発明の透明導電性積層 体に必要に応じて適用されるものであり、高屈折率層と しては、屈折率が1.65以上の例えば2nO,TiO 2, CeO₂, SnO₂, ZrO₂, ITO等を蒸着、 スパッタリング等で形成してもよく、前記金属酸化物等 の微粒子(粒子径1~50nm)を透明バインダー樹脂 に分散せしめ塗布形成してもよく、その厚さは20nm $\sim 2~\mu$ mである。低屈折率層としては、M g F 2, S i 50 厚さ $1~7~5~\mu$ m の透明ポリエチレンテレフタレートフイ

O2等の低屈折率の蒸着、スパッタリング等で形成した ものでもよく、SiO2等のゾルを塗布して形成しても よいもので、その厚さは50 nm~2μmである。本発 明における透明なプラスチック薄膜層とは、本発明にお ける透明導電性積層体に必要に応じて形成することので きる接着剤層、粘着剤層、離形フイルム等が挙げられ る。

【0015】本発明の、高分子フイルムからなる基材 (A) の少なくとも片面に透明導電性薄膜 (B) を積層 した透明導電性積層体において、該積層体が少なくとも 耐塩酸性がR/R。値で60分処理において5以上であ ることが必須であり、耐塩酸性の測定は、「5重量%の HC1水溶液の温度25℃で、透明導電性積層体の5× 10cmの大きさに切り取ったサンプルを、浸漬し、一 定時間毎に取り出して表面 (シート) 抵抗値を4端子計 (三菱化学製)の装置で測定した。5重量%のHC1水 溶液に浸漬処理する前の抵抗値をR。とし、5重量%の HC1水溶液に60分浸漬処理した後の抵抗値をRとし たときのR/R。値を評価する」ものである。このR/ R。値が5以上であることが、耐久性、可撓性に優れた 透明導電性積層体となり、該透明導電性積層体をタッチ パネル使用した時、筆記耐久性が10万回を越えるもの となる作用の詳細は不明であるが、塩酸処理によってR /R。値がより大きく変化することは、結晶や粒子の界 面の多さによるものと考えられ、その界面の多さは結晶 や粒子の小ささに大きく依存しているものと考えられ る。

【0016】透明導電性積層体を使用してタッチパネル を製造した際に要求される筆記耐久性の測定は、「透明 導電性積層体の10×10cmの大きさに切り取ったサ ンプルを、ガラス板上にインジウムー錫系酸化物(IT O)を形成した基板のITO面に、両端部のみ80μm 厚さの粘着テープを介して透明導電性積層体の透明導電 性薄膜部をもって貼り合わせ、下からガラス板、ITO 層、透明導電性薄膜部、高分子フイルムからなる基材と なる構成となし、擬似タッチパネル状物とし、該高分子 フイルムからなる基材面を、先端部が0.8mmφであ るポリアセタール製のペンを使用して、ペン圧2.5 N、ペンスピード150mm/秒で直線40mmを往復 摺動させて、一定往復数後の直線40mm部を挟む5m mの位置における、4端子計(三菱化学製)の装置によ る抵抗値を測定し、該筆記耐久性測定前 (往復摺動前) の抵抗値を r。、一定往復数後の直線 40 mm部を挟む 5 mmの4端子計(三菱化学製)の装置による抵抗値を rとし、r/r。が1.1より大となる往復の数を測定 する」ものであり、その往復の数を筆記耐久性の判定に 用いた。以下に実施例を挙げて説明するが本発明はこれ らに限定されるものではない。

【実施例】*実施例1、2、3

۶

7 ルムを透明導電性薄膜(B)形成用の高分子フイルムか らなる基材(A)として採用した。この基材(A)フイ ルムの一面に、6官能アクリレートモノマー50部、2 官能ウレタンアクリレート31部、光開始剤3部、トル エン100部からなる塗料をハードコート樹脂バインダ 一部分の硬化後の厚みが 3 μ mになるようにメイヤーバ ーにて塗布し、溶剤乾燥後、高圧水銀灯にて紫外線を3 00mJ/cm² 照射し硬化させてハードコート層を形 成した(該ハードコート層の鉛筆硬度は2Hであっ た)。ポリエチレンテレフタレートフイルムの該ハード 10 コート層を設けた面の反対面上に、アルコキシシランの・ 加水分解物(シロキサン結合含有樹脂成分)、シクロへ キサノン、メチルイソブチルケトン、平均粒径12nm のオルガノシリカゾルメチルイソブチルケトン分散液の 混合液(固形分比、シロキサン結合含有樹脂成分:オル ガノシリカゾル成分=5.2:4.8重量比)を、キス コートで塗布し乾燥厚さ0.02μmのアンカー層を形 成した。該アンカー層のRaは7.57nm(Rzは5 6. 3 n m、測定レンジ5 0 0 μ m) であった。このア ンカーコート層上に、SiO₂の10nmスパッタリン 20 グによる薄膜を形成し、このSiO2薄膜上に、該基板 を50℃に保ち、透明導電性薄膜としてITO膜を、イ ンジウム:錫=95:5(金属、モル比)のターゲット を使用し、真空室内を10-3Paとし、ArとO2の 混合ガスを導入しながら2×10-1PaとしてDCス パッタリングで厚さ20nmに形成した。このその後1 50℃で24時間熱処理し、透明導電性積層体を得た。 この透明導電性薄膜形成速度を実施例1として50nm /分、実施例2として60nm/分、実施例3として7 0 n m/分、とした以外は、各実施例は同条件で各透明 導電性積層体を作成した。得られた透明導電性積層体の 全光線透過率は、実施例1が88.3%、実施例2が8 8.0%、実施例3が88.2%であった。これらの透 明導電性積層体の耐塩酸性におけるR/R。値は、実施 例1が10、実施例2が11、実施例3が11であっ た。また得られた各透明導電性積層体を使用してタッチ パネルを製造した筆記耐久性は、実施例1が10万回、 実施例2、実施例3共に10万回以上であった。

【0017】*実施例4、5、6

実施例4として基板温度を基55℃、実施例5として基板温度を基65℃、実施例6として基板温度を基75℃として、アンカー層のRaが7.12nm(Rzは66.3nm、測定レンジ500μm)であること以外は実施例1と同様にして透明導電性積層体を得た。この透明導電性積層体の全光線透過率は実施例4が88.6%、実施例5が88.2%、実施例6が88.5%であった。これらの透明導電性積層体の耐塩酸性におけるR/R。値は、実施例4が11、実施例5が11、実施例6が12であった。また得られた各透明導電性積層体を使用してタッチパネルを製造した筆記耐久性は、実施例4、実施例5、実施例6共に10万回以上であった。

【0018】*比較例1

実施例1における基板温度を40℃、透明導電性薄膜形成速度を30nm/分とした以外は、実施例1と同様にして比較例1の透明導電性積層体を得た。この透明導電性積層体の全光線透過率は87.6%であった。この透明導電性積層体の耐塩酸性におけるR/R。値は、3.0であった。また得られた透明導電性積層体を使用してタッチパネルを製造した筆記耐久性は、3万回であった。

【0019】*比較例2

実施例1における基板温度を30℃、透明導電性薄膜形成速度を30nm/分とした以外は実施例1と同様にして比較例2の透明導電性積層体を得た。この透明導電性積層体の全光線透過率は87.0%であった。この透明導電性積層体の耐塩酸性におけるR/R。値は、2.0であった。また得られた透明導電性積層体を使用してタッチパネルを製造した筆記耐久性は、1.5万回であった

[0020]

【発明の効果】本発明の高分子フイルムからなる基材 (A) の少なくとも片面に、インジウム・スズ・酸化物を主成分とする透明導電性薄膜 (B) を積層した透明導電性積層体であって、該積層体の耐塩酸性がR/R。値で60分処理において5以上であるものは、筆記耐久性に代表される耐久性にすぐれ、可撓性に於いてもすぐれたものであり、タッチパネル等に有効に使用できることが判った。

フロントページの続き

下夕一ム(参考) 4F100 AA17B AA20B AA33B AK01A AK25C AK42A AK52D BA02 BA04 BA07 BA10B BA10C CC00C EH46 EH46D EH66B EJ05 EJ54 EJ86D GB41 JB02 JG01B JK12C JK17 JN01A JN01B YY00 4K029 AA11 AA25 BA45 BA50 BB02 BC09 BD00 BD03 CA06 DC04 5B087 AA04 AA09 CC13 CC14 CC15 CC16 CC36

5G307 FA02 FB01 FC02 FC10